

XII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA
MATÉRIA CONDENSADA, Caxambu,
9-13 maio de 1989

INS 7/16:30/6af.

CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO PARA SISTEMA DE CARACTERIZAÇÃO DE LIGAS Si-Ge

Victor Bertucci Neto, Luiz Francisco de Matteo Ferraz e Odílio B. G. Assis, IQSC-USP

Para o levantamento da curva de mérito das ligas de Si-Ge, usadas em geradores termoeletrônicos, usa-se um forno que deve variar a temperatura entre 200°C a 1200°C. Apresentaremos um controlador de temperatura microprocessado onde podemos modelar o forno com equações lineares de 1º ou 2º grau, em variável z ou s , permitindo assim maior rendimento e estabilidade em temperatura, necessários para a determinação da difusividade térmica, resistividade e efeito Seebeck (parâmetros da curva de mérito).

IQSC-USP/ IEAv-CTA

Campo	Dado
*****	Documento 1 de 1
No. Registro	000802355
Tipo de material	TRABALHO DE EVENTO-RESUMO - NACIONAL
Entrada Principal	Bertucci Neto, V (**)
Título	Controle de temperatura microprocessado para sistema de caracterizacao de ligas 'SI'- 'GE'.
Imprensa	São Paulo : Sociedade Brasileira de Fisica, 1989.
Descrição	ref.ins. p.113.
Autor Secundário	Ferraz, L F M (**)
Autor Secundário	Assis, O B G (*)
Autor Secundário	Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada (12. 1989 Caxambu)
Fonte	Programa e Resumos, São Paulo : Sociedade Brasileira de Fisica, 1989
Unidade USP	IFQSC-F -- INST DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Unidade USP	IFQSC-F -- INST DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Localização	IFSC PROD001097